

Безызлучательные процессы рекомбинации носителей заряда в узкозонных полупроводниках

Аспирант 1 года обучения ИФМ РАН *Мажукина К. А.*

Научный руководитель: Зав. лаб. ИФМ РАН, к.ф.-м.н. **Румянцев В. В.**

Актуальность

Квантовые ямы:

Объемные пленки:



[] V. V. Rumyantsev, K. A. Mazhukina, V. V. Utochkin, et al. / Optically pumped stimulated emission in HgCdTe-based quantum wells: 2 Toward continuous wave lasing in very long-wavelength infrared range // Applied Physics Letters, 124(16), 2024.

01.	02.	03.
Введение	Механизмы рекомбинации	Излучательная рекомбинация
04.	05.	06.
Плазмонная	Оже-	Рекомбинация
и фононная	рекомбинация	Шокли-Рида-
рекомбинации		Холла

Введение



Введение

Если рассмотреть случай, что 1. $g_n = g_p$ (биполярная генерация) и 2. пространственная однородность:



Измерения в условии стационарной генерации

Лазеры накачки:

- непрерывный диодный лазер с длиной волны 808 нм;
- непрерывный диодный лазер с длиной волны 980 нм;
- волоконный лазер с длиной волны 1.9 мкм;
- непрерывный CO₂ лазер с длиной волны 10.6 мкм.



Схема экспериментальной установки для исследования спектров фотолюминесценции (ФЛ) образцов

Измерения релаксации неравновесной концентрации

Прямая методика исследования релаксации сигнала фотоотклика при межзонном возбуждении короткими (1.5 пс – 10 нс) импульсами длинноволнового излучения



Схема экспериментальной установки для исследования кинетики релаксации фотопроводимости **6**

Эксперимент с временным разрешением

Объемные пленки:



Релаксация кинетики ФП объемной пленки 120613 (E_g =87 meV) при возбуждении короткими оптическими импульсами (7 нс) с энергией кванта 150 мэВ. *T*=4.2 *K*.



01. Введение	02. Механизмы рекомбинации	03. Излучательная рекомбинация
04.	05.	06.
Плазмонная и фононная	Оже- рекомбинация	Рекомбинация Шокли-Рида-
рекомбинации		Холла

Основные механизмы рекомбинации



01. Введение	02. Механизмы рекомбинации	03. Излучательная рекомбинация		
04.	05.	06.		
Плазмонная	Оже-	Рекомбинация		
и фононная	рекомбинация	Шокли-Рида-		
рекомбинации		Холла		

Излучательная рекомбинация

Излучательная рекомбинация - межзонная рекомбинация электронов и дырок с испусканием фотона.

Скорость рекомбинации:
$$R = Bnp$$

В условиях теплового равновесия скорость генерации электронов и дырок равна скорости рекомбинации.

Скорость генерации:
$$G = Bn_0 p_0$$

Тогда время излучательной рекомбинации принимает вид:

Время излучательной рекомбинации:

$$au_{
m RR} = rac{\Delta n}{R-G} = rac{1}{B(n_0+p_0+\Delta n)}$$

Эксперимент с временным разрешением



(а) Кинетика ФП структуры с квантовыми ямами ($E_g = 140 \text{ meV}$) при межзонном возбуждении короткими оптическими импульсами (7 нс). T = 77 K. (b) Обратная зависимость кинетики ФП.

$$\frac{\partial \Delta n}{\partial t} = -\frac{\Delta n}{\tau_{RR}}$$
$$\Delta n(t) = \frac{\Delta n(0)(n_0 + p_0)}{\left(n_0 + p_0 + \Delta n(0)\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_0}\right) - \Delta n(0)}$$

где $\tau_0 = B/(n_0 + p_0)$ – время излучательной рекомбинации в пределе $\Delta n \ll n_0, p_0$

Обратная зависимость принимает вид экспоненциальной функции со смещением:

$$1 + \frac{1}{N(t)} = \left(1 + \frac{1}{N_0}\right) \exp(-\frac{t}{\tau_0})$$

где $N(t) = \frac{\Delta n(t)}{n_0 + p_0}, N_0 = N(0)$

Излучательная рекомбинация

Скорость генерации пропорциональна квадрату собственной концентрации носителей заряда и равна скорости поглощения фотонов при температуре Т [*Roosbroeck and Shockley, 1954*]:



Излучательная рекомбинация



Тогда коэффициент излучательной рекомбинации (В) принимает вид:

Коэффициент излучательной рекомбинации:

$$B = 5.8 \cdot 10^{-13} \sqrt{\varepsilon_{\infty}} \left(\frac{300/T}{m_e + m_h} \right)^{\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right) [E_g^2 + 3k_B T E_g + 3.75 k_B^2 T^2] \qquad \qquad \tau_{\rm RR} = \frac{1}{B(n_0 + p_0 + \Delta n)}$$

С уменьшением ширины запрещенной зоны увеличивается время излучательной рекомбинации (при фиксированной концентрации носителей) и важными становятся безызлучательные процессы рекомбинации

01.	02.	03.
Введение	Механизмы рекомбинации	Излучательная рекомбинация
04.	05.	06.
Плазмонная	Оже-	Рекомбинация
и фононная	рекомбинация	Шокли-Рида-
рекомбинации		Холла

Плазмонная и фононная рекомбинация

Плазмонная рекомбинация – межзонная рекомбинация электронов и дырок с испусканием плазменных волн.

Возможна при определенной концентрации носителей заряда и/или определенной массе носителей заряда, чтобы ширина запрещенной зоны была сравнима с энергией коллективных колебаний электронного или дырочного газа.

Фононная рекомбинация – межзонная рекомбинация электронов и дырок с испусканием оптического фонона. Ширина запрещенной зоны должна быть сравнима с энергией оптического фонона (~20 мэВ для CdTe-подобных оптических фононов и (~15 мэВ для HqTe-подобных оптических фононов).

Очень быстрые процессы (**т~10⁻¹² с**), возможные в полупроводниках с очень малой шириной запрещенной зоны (**E_a ~ десятки мэВ**)

Η	g	Cd	7	e,	T	=	7	7	K	

n _{th} , cm ⁻³	<i>E_{pl}</i> , meV
10 ¹⁷	32
10 ¹⁶	14

Дисперсионная зависимость фононов



01. 0 Введение

02. Механизмы рекомбинации 03. Излучательная рекомбинация

04. Плазмонная и фононная рекомбинации

05. Ожерекомбинация 06. Рекомбинация Шокли-Рида-Холла

Пороговая энергия оже-рекомбинации



Оже-рекомбинация



Chu, J., A. Sher / Device Device Physics of Narrow Gap Semiconductor // New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2010.

Оже-рекомбинация

Время жизни оже-рекомбинации [Beattie and Landsberg, 1959]:



описывающий экранировку носителей заряда, опускается.

Оже-рекомбинация



[] S. Krishnamurthy, M. A. Berding, Z. G. Yu / Minority Carrier Lifetimes in HgCdTe Alloys // Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 2006.

21

Эксперимент с временным разрешением



01.	02.	03.
Введение	Механизмы рекомбинации	Излучательная рекомбинация
04.	05.	06.
Плазмонная	Оже-	Рекомбинация
и фононная	рекомбинация	Шокли-Рида-
рекомбинации		Холла

Рекомбинация через примеси и дефекты

Будем рассматривать простые центры рекомбинации, которые могут захватывать/отдавать один электрон (*ē*), те находиться только в двух различных состояниях.

Четыре типа элементарных процессов при рекомбинации электронов и дырок через примесные центры.



24

Рекомбинация через примеси и дефекты



где n_1 и p_1 - концентрации носителей в зоне, когда уровень Ферми совпадает с уровнем ловушки

Рекомбинация через примеси и дефекты

Тогда суммарные темпы захвата электронов и дырок имеют вид:

Суммарный темп захвата \bar{e} на ловушки:

$$R_n = \alpha_n N_t [(1 - f(E_t))n - f(E_t)n_1]$$

Суммарный темп захвата *h* на ловушки:

$$R_p = \alpha_p N_t [f(E_t)p - (1 - f(E_t))p_1]$$

А уравнения для неравновесных носителей принимают вид:

Уравнения для неравновесных носителей:

$$\frac{dn}{dt} = g_n - R_n = g_n - \alpha_n N_t [n(1-f) - n_1 f]$$
$$\frac{dp}{dt} = g_p - R_p = g_p - \alpha_p N_t [pf - p_1(1-f)]$$

$$p - p_0 = n - n_0 + N_t (f - f_0)$$

Поскольку уравнения для неравновесных носителей нелинейны, то в общем случае закон изменения концентраций ē и h не выражается экспонентой.

Нестационарный процесс



При биполярном возбуждении темп рекомбинации электронов определяется избыточной концентрацией и электронов, и дырок; поскольку и те, и другие изменяют заполнение ловушек. Δ*n* ≠ Δ*p* Решая уравнения 2 порядка, получаем зависимость неравновесных носителей, которая принимает вид:

$$\Delta n(\Delta p) = B_{n(p)} \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + C_{n(p)} \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)$$

Таким образом, изменение избыточных концентраций электронов и дырок описывается 2 экспонентами → существуют 2 времени релаксации (одинаковых для электронов и дырок).

Частный случай:

Если концентрация ловушек велика и температура низкая,

$$N_t^0 \gg n_0 + n_1$$
 , $N_t^- \gg p_0 + p_1$.

N_t – равновесная концентрация пустых(0), заполненных(-) ловушек.

то τ_1 – время захвата электронов, τ_2 – время захвата дырок.

Релаксация кинетики ФП одиночных КЯ при межзонном возбуждении короткими оптическими импульсами (~10 нс).

Малая концентрация ловушек

Избыточные концентрации электронов и дырок можно считать одинаковыми, те $\Delta n = \Delta p$

Время рекомбинации в модели Шокли-Рида-Холла:

1

$$\tau_{SRH} = \frac{\tau_{n0}(p_0 + p_1 + \Delta n) + \tau_{p0}(n_0 + n_1 + \Delta n)}{n_0 + p_o + \Delta n}$$

$$n_1 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{kT}\right)$$
 $p_1 = N_v \exp\left(-\frac{E_t - E_v}{kT}\right)$

где n_1 и p_1 - концентрации носителей в зоне, когда уровень Ферми совпадает с уровнем ловушки

При малой концентрации ловушек время жизни для электронов и дырок одно и зависит от уровня возбуждения.

Частные случаи





Рис. 9.7. Время жизни неравновесных электронов и дырок при бесконечно малом (τ_0) и бесконечно большом (τ_∞) уровнях возбуждения.

- Если уровень возбуждения мал, то время перестает зависеть от Δn .
- При высоком уровне возбуждения время жизни одинаково для e u h не зависит от концентрации неравновесных носителей, а определяется меньшим коэффициентом захвата.

Доминирующие механизмы рекомбинации



Спасибо за внимание!



Малая концентрация ловушек

Избыточные концентрации электронов и дырок можно считать одинаковыми, те $\Delta n = \Delta p$



При малой концентрации ловушек времена жизни для ē и h одинаковые и зависят от уровня возбуждения.